

# TYPE-C 2.0(单电阻)测试实例

本节主要介绍 TYPE-C 2.0 单电阻手机数据线的测试方法,测试项目包括短断路(O/S),导通阻抗,DC 绝缘,AC 耐压,元件测试(电阻),摇摆测试(OS 瞬短,OS 瞬断)共计6个项目;

下面就以 TYPE-C2.0(单电阻) 版本举例说明

### 步骤1:准备治具及档案

将待测线材需用的治具插到测试机上,不要接线材产品。 读取或新建档案:按【档案】键,打开设备档案管理窗口,通过【↑】【↓】方向键移动橙 色光标来选择需要使用的档案,按【确认】键读取该档案; 或按下【F1】新建档案,自定义输入档案名称,再按【确认】键完成新建。

<u>注:如果之前当前线材产品已有档案,并且治具接点也是相同的,(包括<u>连接 PIN 位相同</u>),</u>

<sub>则直接跳到</sub> 步骤 7

## 步骤 2:【模式】界面设置 {测试内容}

🚺 诚创立	® 总数	ι: <b>Ο</b>	良品:	۵)	不良品:	٥
测试任务	测试内容	线材学习	导通电阻	高压	元器件	系统
测试方式:	(一般测试		0S测试:	开启		OS测试
0S短路电阻	: <u>5κΩ</u> : <u>5κΩ</u>		导通测试:	开启		导通测试
单边灵敏度: 导通阻抗:	20 0.150Ω		DC绝缘测试:	开启		DC测试
OS瞬短测试 OS瞬版测试	时间: () 时间: ()	0.500S	AC耐压测试:	开启		AC测试
手动测试适	应时间: (	0.200S	元件测试:	开启		元件测试
分 步 测 试 切 ! 定 时 模 式 间 !	奥万式: 🚺 🚺 隔时间: 💦	■动识别 ) 1.000S	摇摆测试:	开启		
		^ ^	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	IT2. 4 / 4		摇摆测试
	20% 相条:	2	则认少	家.  /	一、二月町川	管、尢限制

按下【模式】键,切换至{测试内容}页面,通过【↑】【↓】方向键移动橙色光标来选择 需要设置的参数,按【确认】键切换参数。需要输入数值的参数,用数字键盘输入后,再按 【确认】键完成设置



<u>注意:因 TYPE-C 线材结构特殊,为方便后续步骤编辑【元件】电阻;在当前步骤,我们要</u> <u>做的是找出元件电阻的两只脚,方便后续设置</u>

- 默认设置如下: 测试方式:一般测试(默认) OS 断路电阻:5KΩ(默认) OS 短路电阻:5KΩ(默认)
- 2. 将待测品 TYPE-C 线材(良品样品)插入治具
- 3. 按【读点】键,读取当前点位

如图:



4. 将模式界面中相关参数设置如下:

测试方式:一般测试 OS 断路电阻:100KΩ OS 短路电阻:100KΩ

		16	XXIIII	L				
IJ	<b>y</b> 1	成创立	® 总	数: 0	良品:	۵	不良品:	0
į	测试	任务	测试内容	线材学习	导通电阻	高压	元器件	- 系统
ſ	测试	方式:	(一般测试	t )	 0S测试:	开启		OS测试
	OS断 OS短	路电阻 路电阻	: < 100KΩ		导通测试:	开启		导通测试
	单边	灵敏度:	20		DC绝缘测试:	开启		DOTIN
	守通	阳 九: 注京测试者	U.150Ω 时间·	0.5008	AC耐压测试:			して沢川は、
	OS瞬	断测试	时间:	0.5008	元件测试·			AC测试
	于动	则试道) 则试切	回时间: 换方式:  {	0.200S 自动识别 >	握挥测试·	一方后		元件测试
U	定时	模式间	隔时间: 🦳	1.000S		サ月	رلــــــ	摇摆测试
6	<b>日:12</b> 一 か	<b>ごES</b>	<b>36% 档案</b> :	: 1 <b>2*</b>	测试步	骤: 1/	1 治具耐	磨:无限制
).	· 按【读点】键,读取当前点位							
_	如图	:		, <u>,</u>				
$\mathcal{T}$	een	成创立	® <mark>ë</mark>	数: 0	良品:	0	不良品;	٥
	刘试	成创立 任务	® <mark>总</mark> 测试内容	数: 2 线材学习	良品: 导通电阻	₿ 高压	不良品: 元器件	D = 系统
	如函 <b>》</b> 订 则试 则试方	: 成创立 任务 :式:一船	® <sup>总</sup> 测试内容 <sub>受测试</sub> 断路电	数: 线材学习 电阻:100KΩ短路	良品: 导通电阻 电阻:100KΩ灵	0 高压 敏度:20	不良品: 元器件	D) = 系统
	如函 <b>测试</b> 则试方 序号	: 成创立 任务 <sup>:</sup> 式: 一 <sup>府</sup> 组别	8	数: <u>线材学习</u> 电阻:100KΩ短路 连	良品: <b>导通电阻</b> 电阻:100KΩ灵 :接点位	2 高压 敏度:20	不良品:	D - 系统
	如函 <b>》</b> 別 试 加 が の が の 、 が の し の い の い の い の い の い の い し の し い の し い の し い の し い の し い い い し い し い し い し い し い い い い い い い い し い し い い い い い い い い い い い い い	: 成创立 任务 <sup>:</sup> 式:一 <sup>A</sup> 组别 1	·® 总 测试内容 <sup>2</sup> <sup>2</sup> 测试断路电 <sup>2</sup> 名称 7P	数: □ 线材学习 E阻:100KΩ短路 连 A3-A4-B5-	良品: <b>导通电阻</b> 电阻: 100KΩ 灵 接点位 -B16-B17-B28	0 高压 敏度:20	不良品: 元器件 18点 测量条件 <100KΩ	2 <b>系统</b> 分组方式
	如函 测试 则试方 序号 1	: 成创立 任务 式:一 <sup>角</sup> 组别 1	8 总 测试内容 2 测试的路电 2 别试断路电 名称 7 P	数: 2 线材学习 电阻:100KΩ短路 连 A3-A4-B5-	良品: 导通电阻 电阻:100KΩ灵 :接点位 -B16-B17-B28 -B29 7 D02	0 高压 敏度:20	不良品: 元器件 18点 测量条件 <100KΩ	<ul> <li>S统</li> <li>分组方式</li> <li>开路归零</li> </ul>
	如函 测试 则试方 序号 1 2 3	: 成创立 任务 式:一和 组别 1 1	® 总测试内容       测试内容       2P       2P       2P	数: □ 线材学习 2011:100KΩ短路 注 A3-A4-B5- - A	良品: 导通电阻 电阻:100KΩ灵 :接点位 -B16-B17-B28 -B29 7-B23 9-B22	0 高压 敏度:20	不良品: 元器件 18点 测量条件 <100KΩ <100KΩ	0 系统 分组方式 开路归零
	如函 测试 则试方 序号 1 2 3 4	式:一角 组别 1 1	® 总 测试内容 受测试断路电 名称 7P 2P 2P 2P 7P	数: 3 线材学习 2011:100KΩ短路 连 A3-A4-B5- A A3-A4-B5- A A12-B8-B9	良品: <b>导通电阻</b> 电阻:100KΩ灵 -B16-B17-B28 -B29 7-B23 9-B22 0-B13-B20-B2	0 高压 敏度:20	不良品: 元器件 18点 测量条件 <100KΩ <100KΩ <100KΩ <100KΩ <100KΩ	<ul> <li>系统</li> <li>分组方式</li> <li>开路归零</li> <li>短路归零</li> </ul>
	如函 测试方 序号 1 2 3 4	: 成创立 任务 <del>武:一和</del> 组别 1 1 1 1	® 总 测试内容 受测试断路电 名称 7P 2P 2P 2P 7P	数: 3 线材学习 E阻:100KΩ短路 连 A3-A4-B5- A A A12-B8-B9	良品: <b>导通电阻</b> 电阻:100KΩ灵 -B16-B17-B28 -B29 7-B23 9-B22 -B13-B20-B2 -B25	☐ 高压 敏度:20	不良品: 元器件 18点 测量条件 <100KΩ <100KΩ <100KΩ <100KΩ	2 系统 分组方式 开路归零 短路归零
	如函 测试方 序号 1 2 3 4	成创立 任务 式:一 <sup>角</sup> 组别 1 1	® 总 测试内容 受测试断路电 名称 7P 2P 2P 2P 7P	数: 3 线材学习 建阻:100KΩ短路 连 A3-A4-B5- A A A A12-B8-B9	良品: <b>导通电阻</b> 电阻:100KΩ灵 -B16-B17-B28 -B29 7-B23 9-B22 9-B22 -B13-B20-B2 -B25	☐ 高压 敏度:20	不良品: 元器件 18点 测量条件 <100KΩ <100KΩ <100KΩ <100KΩ	2 系统 分组方式 开路归零 短路归零
	如函 则试方 序号 1 2 3 4	成创立 任务 式:一和 组别 1 1	8 总 测试内容 2P 2P 7P 7P	数: 3 线材学习 型阻:100KΩ短路 连 A3-A4-B5- A A A12-B8-B9	良品: <b>导通电阻</b> 电阻:100KΩ灵 电阻:100KΩ灵 7-B23 9-B23 9-B22 0-B13-B20-B2 -B25	○ 高压 敏度:20 3 4	不良品:	<ul> <li>系统</li> <li>分组方式</li> <li>开路归零</li> <li>短路归零</li> <li>参数设置</li> </ul>

确认所读出点位序列无误后,此时原先名称标注为(5P)的连接对,应为(6P) 对比之前的点位,找出多出来的一个点位,并作出记录,此时得出结果为:(B9;B24 为多出来的两个点位, 与原来 5P 中的 B8,B13,B20,B25 其中任一一个点位组成电阻的两 只脚位。(如:B8-B9;B8-B24为两个电阻的脚位)

- 6. 将待测品 TYPE-C 端更换一面插入治具,继续重复 5 步骤,找出另外一面的电阻脚位。 (并作出记录,如:\*\*\*,以备后面编辑电阻使用)
- 7. 完成记录后,将【模式】界面中相关设置还原为:

测试方式:一般测试 OS 断路电阻:5KΩ OS 短路电阻:5KΩ

<u> </u> 诚创立	·® 总	数: {	3 良品:		不良品:	C
测试任务	测试内容	线材学习	导通电阻	高压	元器件	系统
测试方式;	(一般测)	±	0S测试:	开启		OS测试
OS断路电阻 OS短路电阻	<ul> <li>≤ 5KΩ</li> <li>≤ 5KΩ</li> </ul>		导通测试:	开启		导通测试
单边灵敏度: 导通阻抗:	20 0.150Ω		DC绝缘测试	开启		DC测试
0S瞬短测试	时间; 🗌	0.500S	AC耐压测试	开启		ACTURE
0S瞬断测试 手动测试适	时间: 立时间:	0.500S	元件测试:	开启		ACAMA
分步测试切	奥方式: 🤇	自动识别	摇摆测试:	开启		元件测试
		1.0005				Arts Arm Med And
						摇摆测记
ひ <b>08 23℃</b> 设署 {导通M	<b>36% 档案</b> 1抗}	:12	测试步	骤: 1/	1 治具耐	·磨:无限制
10 08 23℃ 设置 {导通阳	<b>36% 档案</b> 1抗}: 1 <b>立<sup>®</sup></b>	:12 总数:	测试步	骤: 1/	1 治具耐 2 不良品	· 摇摆测试 · 磨: 无限制 品:
10 08 23 C 设置 {导通阳 诚创 测试任	36% 档案 1抗}: 11立 <sup>®</sup> 为 测试	:12 总数: 内容 线材学	测试步 2〕良品: 2〕 导通电	·骤: 1/ 阻高/	1 治具耐 [] 不良品 压 元者	<ul> <li>描接测试     <li>·磨: 无限制     </li> <li>品:     </li> <li>器件 系线     </li> </li></ul>
10 08 23 C 设置 {导通阴 诚创 测试任	36% 档案 1抗}: 1)立 <sup>®</sup> 务 测试	:12 总数: <mark>内容</mark> 线材学	》 〕 良品: 之习 导通电	े骤: 1∕ 阻 高/	1 治具耐 2 不良品 压 元者	<ul> <li>描接测试</li> <li>···································</li></ul>
10 08 23 C 设置 (导通阴 ) 诚仓 测试任 ] 测试子	36% 档案 計計 : リ立 <sup>®</sup> 外 別は「	:12 总数: <mark>内容 线材学</mark> &测试 )	测试步 ② 良品: <sup>2</sup> 习 导通电 OS测试:	·骤:1/ 阻高/	1 治具耐 C 不良品 压 元者 启	<ul> <li>描接测试</li> <li>溶:无限制</li> <li>品:</li> <li>器件 系组</li> <li>OS初</li> </ul>
12 CB 23 C 设置 {导通阴 诚创 测试任 	36% 档案 目抗}: リ立 <sup>®</sup> 务 测试 に も阻: 4 5 も阻: 4 5	:12 总数: 内容 线材学 <sup>股</sup> 测试 )	测试步 〕 良品: <sup>2</sup> 习 导通电 OS测试: 导通测	·骤: 1/ 阻高/ <i>开</i>	1 治具耐 了不良品 压 元者 宿	<ul> <li>描張测试</li> <li>(磨: 无限制)</li> <li>品:</li> <li>器件 系统</li> <li>OS初 具通</li> </ul>
2008 23で 设置 (导通阴 ) () () () () () () () () () () () () ()	35% 档案 計計}: 引立 <sup>®</sup> 列立 <sup>®</sup> 列: 利 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	:12  总数:    内容 线材学    数  试 )  KΩ )	测试步 〕 良品: <sup>2</sup> 习 导通电 OS测试: 导通测i	·骤: 1/ 阻高/ (开 式: 开	1 治具耐 C 不良品 压 元者 启	<ul> <li>描張测试</li> <li>磨: 无限制</li> <li>品:</li> <li>器件 系统</li> <li>OS划</li> <li>导通</li> </ul>
2 08 23 设置 {导通附 诚位 测试任 のS断路 単边灵報 导通阻扎	36% 档案 計) 力 立 ® 減 減 、 、 一 和 、 、 、 一 和 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	:12 总数: 内容 线材学 微测试 、 KΩ 、	<ul> <li>测试步</li> <li>〕</li> <li>良品:</li> <li>う</li> <li>予通电</li> <li>OS测试:</li> <li>导通测i</li> <li>DC绝缘;</li> </ul>	·骤: 1/ 阻 高/ 	1 治具耐 () 不良品 压 元 信 信 信	<ul> <li>描張测试</li> <li>磨:无限制</li> <li>品:</li> <li>器件 系组</li> <li>OS测导通</li> <li>DC测</li> </ul>
2 08 23 设置 {导通附 诚仓 测试任 のS断路 身通阻 り のS瞬短 のS瞬短	36%     档案       引立 <sup>®</sup> 測试目       方立 <sup>®</sup> 測试目       大:     (一角)       も阻:     5       も阻:     5       支度:     20       た:     0.15       则试时间:	:12 总数: 内容 线材学 强测试 ) KΩ ) 50Ω 1.000S	<ul> <li>测试步</li> <li>〕</li> <li>良品:</li> <li>う</li> <li>う&lt;</li></ul>	·骤: 1/ 阻 高/ 式: 开 则试: 开 则试: 开	1 治具耐	<ul> <li>描張测试</li> <li>磨:无限制</li> <li>品:</li> <li>器件 系线</li> <li>のS別</li> <li>导通</li> <li>DC別</li> </ul>
12 08 23 设置 (导通阴 ) 设置 (导通阴 ) 減估 別试任 のS断路路 単边灵明 のS瞬短 のS瞬距 のS瞬距	36% 档案 1抗}: 小立 <sup>®</sup> 列立 <sup>®</sup> 利立 <sup>®</sup> 利立 <sup>®</sup> 利式 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	:12 总数: 内容 线材学 强测试 ) KΩ ) 50Ω 1.000S 1.000S	<ul> <li>测试步</li> <li>良品:</li> <li>う 导通电</li> <li>OS测试:</li> <li>导通测i</li> <li>DC绝缘:</li> <li>AC耐压:</li> </ul>	·骤: 1/ 阻 高 式: 开 则试: 开 则试: 开	1 治具耐	<ul> <li>(描張)(13)</li> <li>(唐: 无限制)</li> <li>高:</li> <li>寄件 系线</li> <li>のS別</li> <li>导通</li> <li>DC別</li> <li>AC別</li> </ul>
2 08 23 C 设置 {导通阴 诚住 测试任 则试任 のS断短路 早通阻 のS瞬距第 のS瞬距第 のS瞬間新 のS瞬間新 のS瞬間新 のS瞬間新	35%       档案         1立®          J立®          J立®          人立®          人立®          人立®          人立®          人立®          人立®          人立®          人立®          人立®          人」立®          人」立          人」立          人」立          人」立          人」立          人」立          人」立          人」          人」      <	:12 总数: 内容 线材学 欧赋 、 KΩ 、 KΩ 、 T.000S 1.000S 0.200S	<ul> <li>         測试步         夏 良品:         2 う 导通电         OS测试:         导通测:         DC绝缘:         AC耐压:         元件测:         2         2         3         4         3         5         4         4         5         5         4         5         5         4         5         5         6         6         6         6         6         7</li></ul>	·骤: 1/ 阻 高 , 开 式: 开 则试: 开 则试: 开 式: 开	1 治具耐 で、 「不良品 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 て し 「 「 て し 「 「 て し 「 「 て し 「 の 「 の 「 の 「 の 「 の 」 「 て し 「 の 「 の 」 「 の 」 「 の 」 の 」 「 の 」 「 の 」 「 の 」 「 の 」 「 の 」 「 の 」 「 の 」 「 の 」 「 の 」 「 の 」 「 の 」 「 の 」 「 の 」 「 の 」 「 の 」 「 の 」 の 」	<ul> <li>描張测试</li> <li>: </li> <li: <="" li=""> <li>: </li> <li>: </li> <li>: </li> <li< td=""></li<></li:></ul>
208) 23°C 设置 (导通阴 成色 测 成日 別 のS断短 り のS時時 時間 のS時時 時間 のS時時 時間 の の い の の い の い の い の い の い の い の い の い の い の い の い の い の い の い の い の い の い の い の い い い の い の い の い の い の の の の の の の の の の の の の	35%       档案         1立 <sup>®</sup> 测试「         1立 <sup>®</sup> 测试「         方       测试「         方       1         方       1         方       1         方       1         方       1         方       1         方       1         大:       1         大:       1         大:       1         大:       1         大:       1         小试时间:       1         川试时间:       1         川试时间:       1         川试时间:       1         川试时间:       1         川试时间:       1         川试时间:       1         川试時市前:       1         小试時市前:       1         小山陽時前:       1         小山陽時,       1         小山陽時,       1	:12 总数: 内容 线材学 設測试→ KΩ→ 50Ω 1.000S 1.000S 0.200S ◆ 自动识别→ 1.000S	<ul> <li></li></ul>	·骤: 1/ 阻 高	1 治具耐 7 良品 正 元者 启 启 启	<ul> <li>         · 描張则词</li> <li>         · 序: 无限制</li> <li>         · 子(本)     </li> <li>         · 子(本)     </li> <li>         · 子(本)     </li> <li>         · 子(本)     </li> <li>         · 一(本)     </li> <li>         · 一(本)     </li> </ul>

=0.1Ω)

因当前产品的导通阻抗设置有两个不同的标准分别为(0.15Ω;0.6Ω) 《之后的【导通】界面操作中,我会作出说明》 先将 0.15Ω作为统一标准,输入至导通阻抗参数中,按【确认】键完成此项设置。

9. OS 瞬短测试时间; OS 瞬断测试时间设置(摇摆时间设置)

<b>WN</b> if t	到立					5
🕔 诚创立	® 总数	:0	良品:	0	不良品:	0
测试任务	测试内容	线材学习	导通电阻	高压	元器件	系统
测试方式:	(一般测试		0S测试:	开启		OS测试
0S团路电阻; 0S短路电阻; 单边灵敏度;	5KΩ 5KΩ		导通测试;	开启		导通测试
导通阻抗:	0.150Ω		DC绝缘测试:	开启		DC测试
OS瞬短测试 OS瞬断测试	时间: <mark>0</mark> 时间: 0	.500S	AC耐压测试:	开启		AC测试
手动测试适应 分步测试切机	应时间: 0 與方式: (自	.200S 动识别 >	摇摆测试:	ガ月		元件测试
定时模式间降		.0005				摇摆测试
	19% 档案:12	2*	则试步	繁: 1/ 1	」治具耐風	營:无限制

将橙色光标移动至{OS瞬短测试时间}参数,用数字键盘输入指定时间,按【确认】 键完成设置;OS瞬断测试时间设置方法与之相同 (注意:一般情况下,摇摆测试时间只有一个时间值,此处需要设置两个时间,所以; 假设摇摆时间要求为1.00S(秒),就拆分为两个0.500S进行设置即可) 如果需要无限时间摇摆,请将这两项时间参数值,设置为0.00S。

10. 设置 {测试项目} 的开启和关闭 当前界面中 {测试项目} 的开启或关闭,是由功能键【F1】-【F6】来控制的, 如需设置请按屏幕右侧的【F1】-【F6】进行操作 当前测试条件需要将所有项目全部 {开启}



## 步骤3:【高压】界面设置

₩₩ 诚创立 <sup>®</sup>	总数:	0 良品:	□ 不良品:	0
测试任务 测i	试内容 线林	オ学习 导通电阻	高压 元器件	系统
DC参	数设置	高压测试	试参数	DC空测
DC高压: 绝缘阻抗: 高压保持时间: 电弧侦测等级:	500V 100MΩ 0.100S 7	》试方式: 自动放电: 空点测试: 接地点:	L 最优测试 ♪ L 否 ♪ A1	AC空测
AC高压:	数设置 200V	线材拔出过早检 高压爬升时间:	:测:   是	
AC频率: AC归零值: 泥中海·	<ul> <li>60Hz</li> <li>0.000mA</li> <li>0.500mA</li> </ul>	→ 最大测试点数: A端最大测试点数 B端最大测试点数	<u>所有点</u> 数: 所有点 数: 所有点	
漏电流: 高压保持时间: 电弧侦测等级:	0.500mA 0.100S 7			
PR 0765 0511	6 档案:12*	测试步	·骤: 1/ 1】治具耐	/ 磨: 无限制)

按【高压】键,切换至{高压}设置页面,参数设置如下: DC高压:500V 绝缘阻抗:100MΩ 高压保持时间:0.1S 电弧侦测等级:7

AC 高压:200V 漏电流:0.5mA 高压保持时间:0.1S 电弧侦测等级:7

#### (其它未作说明的项目,不需要更改,请采用:默认值)

 将橙色光标移动至上述各个参数,用数字键盘输入对应参数值,按【确认】键完成单个 项目设置,重复此步,依次完成所有列举项的设置。 い、成创立。

## 步骤4:【导通】界面设置

7	<b>M</b> ù	成创立	®	总数: 🚺	良品:	0	不良品:	0
	测试	任务	测试内	容 线材学习	导通阻抗	高压	元器件	系统
1	测试方 测试速	[式:一舟 [度: 快	<sub>と</sub> 测试 、速	导通值:0.150Ω 瞬间差:0.100Ω	不合格项目数	k: 0	12 1/2	导通测试
	序号	组别	名称	连接点位	实测导通值	标准值	瞬间差	
	1	1	7P	A3-A4	0.249Ω	0.150Ω	0.10Ω	甲个测试
	2	1	7P	A4-B5	0.375Ω	0.150Ω	0.10Ω	
	3	1	7P	B5-B16	0.461Ω	0.150Ω	0.10Ω	
	4	1	7P	B16-B17	0.352Ω	$0.150\Omega$	0.10Ω	
	5	1	7P	B17-B28	0.524Ω	0.150Ω	0.10Ω	
	6	1	7P-	B28-B29	0.900Ω	0.150Ω	0.10Ω	
	7	1	2P	A7-B23	0.750Ω	0.150Ω	0.10Ω	
	8	1	2P	A9-B22	0.772Ω	0.150Ω	0.10Ω	参数设置
1	1121	230	19% 档理	⊊·12	测试步	·骤·1/1	治旦耐	▶ 麼·无限制

1. 因 TYPE-C 产品有两个导通阻抗测试标准, (如:VBUS 和 GND 红黑线要求导通阻抗值 为 0.15Ω; D+和 D-绿白线要求导通阻抗值为 0.6Ω.)

所以我们需要针对单个连接对编辑不同的参数。如下图所示

7	VN ¥	成创立	<u>e</u> ®	总数: 🚺	良品:	0	不良品:	٥
	测试	任务	测试内	容 线材学习	导通阻抗	高压	元器件	系统
	测试方 测试速	[式: 一舟 [度: 快	段测试 、速	导通值:0.150Ω 瞬间差:0.100Ω	不合格项目	数:0	12	导通测试
	序号	组别	名称	连接点位	实测导通值	标准值	瞬间差	No A TOLL D
	1	1	7P	A3-A4	0.249Ω	0.150Ω	0.10Ω	甲个测试
	2	1	7P	<b>WA单个参数设置</b>	pΩ	0.150Ω	0.10Ω	
	3	1	7P	连接对· A7 -	B23 Ω	0.150Ω	0.10Ω	
	4	1	7P	标准值: 0.150Ω	Ω	0.150Ω	0.10Ω	
	5	1	7P	误差值: 0.100%	ΩĮ	0.150Ω	0.10Ω	
	6	1	7P	DZO-DZ9	Ω000.0	0.150Ω	0.10Ω	
	7	1	2P	A7-B23	0.750Ω	0.150Ω	0.10Ω	
	8	1	2P	A9-B22	0.772Ω	0.150Ω	0.10Ω	参数设置
	11:24	230	[1]%]档题	案:12*	测试	步骤: 1/ 1	治具耐	磨:无限制

将橙色光标移至需要更改的连接对,按下【确认】键,出现{单个参数设置}对话框,再移动光标选中标准值参数,输入参数值,按【确认】键,再按【退出】键。此时标准值一项就 更改完成,在标准值一栏中能体现出来。

2. 导通 {参数设置}

导通界面下,按【F6】{参数设置}出现参数设置对话框,如下图

		in	X Əli İ	Ż				8
5	UN i	成创立	®	总数: 🚺	良品:	0	不良品:	0
	测试	任务	测试内	容 线材学习	导通阻抗	高压	元器件	系统
	测试方 测试速	ī式:一舟 ]度: 快	<sub>원</sub> 测试 는 速	导通值:0.150Ω 瞬间差:0.100Ω	不合格项目数	k: 0	12	导通测试
	序号	组别	名称	连接点位	实测导通值	标准值	瞬间差	
	1	1	7P -	WA 参数设置		0.150Ω	0.10Ω	单个测试
	2	1	7P	测试速度: 💶 🖞	速 )	0.150Ω	0.10Ω	
	3	1	7P	导通值: 0.1	50Ω 10Ω	0.150Ω	0.10Ω	
	4	1	7P		000	0.150Ω	0.10Ω	
	5	1	7P	兵差氾固: <u></u> 导诵臆间测试次数	b. 0	0.150Ω	0.10Ω	
	6	1	7P	导通测试错误等待		0.150Ω	0.10Ω	nni nA
	7	1	2P	矫正值: ◆扣除▶	0.000Ω	0.150Ω	0.10Ω	<i>前</i> 序系
	8	1	2P	A9-B22	0.772Ω	0.150Ω	0.10Ω	<b>全带</b> 边里
	85:11	240	8% 档理	<b>案:12</b> *	测试步	骤: 1/ 1	)治具耐	参数设直 磨:无限制
移	动橙色	光标至	{导通测试	错误等待},按【确	认】键将默认	值为 {否}	的选项,	改为 {是}

此功能是为了防止因线材插入不到位,而导致测试机误判导通不良。 (具体是否开启此选项,需使用者自定标准!)

## 步骤 5:元器件(电阻)界面设置

1.按【元件】按键进入 {元器件} 设置界面, 按【F1】进入 {元件添加向导} 对话框, 元件 类型默认为 {电阻}, 用方向键移动橙色光标至电阻值设置项, 如下图:

₩₩ 诚创立 <sup>®</sup>	总数: 🚺	良品:	3 不同	3品:	٥
测试任务 测试内	容 线材学习	导通电阻	高压	器件	系统
序号 组别 请选择元 则试项 □ 电阻(	添加向导 件类型 《 电阻 目 直 《= 》 1.000	 KΩ5%	0_0  试项	0/0 误差	添加
——测试条 测量电压 保持时间	件连排 :	度点位 [			学习 A
「おおりをちて 18% 档	· ·案: 12*	测试步骤	聚: 1/ 1	治县耐磨;	B 无限制
用数字键输入电阻值,( <mark>如</mark>	1:56KΩ,请输入5	6, 按【F3】选打	译 K Ω单位,	按【确认	】键完

成输入)。【F2-F4】为选择电阻值单位(Ω, K Ω,M Ω)



<b>【【】</b> 诚创 3	立 <sup>®</sup> <mark>总数</mark>	: 0	良品:	0	不良品:	0
测试任务	测试内容	线材学习	导通电阻	高压	元器件	系统
序号组别	<b>山</b> 元件添加	向导		0 	0/0 〔 误差	添加
	请选择元件类都 测试项目————————————————————————————————————					Ω
			<u> </u>			KΩ
			<sub>妾点位</sub>			MΩ
	测量电压: 5 保持时间: 0	.00V .00S	1 - <u>A1</u> + -			A
						В
1137 250	C 13% 档案:1	2*	测试步	骤: 1/	1 治具耐風	晉: 无限制

移动橙色光标至正负误差%比一项,数字键盘输入误差比例。输入后按【确认】完成修改。
 (默认值为 5%)

3. 移动光标至 {连接点位}, 输入电阻的两只脚位(具体点位请参照步骤 3 中第 5 项所找出的点位如: B8-B9; B8-B24)

输入方法:光标移动至+极项,按【F5】-【F6】选对 A, B, 用数字键盘输入电阻脚位。 如输入 B8,选按【F6】选择 B, 再按数字键盘【8】选择 8, 完成后按【确认】键完成+极 点位设置。

光标移动至-级项,参照上述输入方法,完成-级点位设置,按【确认】完成 连接点位设置完成后,按【F1】键,完成添加,如下图:

₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩	总数: 🚺	良品:	【 不良品:	0
测试任务 测试内	容 线材学习	导通电阻 高	下 元器件	系统
	连接占位   3	则试条件	1 1/1	添加元件
	B8-B24	56	.000KΩ 5%	元件测试
				全部测试
				编辑元件
				复制元件
				删除元件
11 52 26℃ 16% 档题	案: 12 <b>米</b>	测试步骤:	1/1 治具耐	磨:无限制
为防止连接点位在输入过档	E中出错,请在完成》 <del>音:霓海拉立中上》</del>	态加后,按下【F3】	】{元件测试},) ·测试顶山由阳	测试一下当 佐日二红石



因当前举例,为双电阻 TYPE-C 的线材,需再按【F1】键继续重复上述 1-3 步骤,添加电阻 2 (脚位为:B8-B24)

具体步骤省略, 请参照 1-3 项操作方法

### 步骤 6. 添加 {分步}测试设置

注意:完成 TYPE-C 其中一面的设置后,按【测试】键,进行一次测试,检查当前设置有无错误,再进行添加分步设置。

原因:因添加分步时,第二步的所有参数,如{模式}{高压}参数都会直接被复制到第二 步中,如果第一步设置错误,则第二步也同样错误。

<mark>(复制的参数不包括 {点位排列}, {导通数值}, {元件电阻设置} 以及与正反面的点位变动 有相关的参数值)</mark>

1.按【模式】键,进入{测试内容},注意界面底部其中一项为(测试步骤 1/1),示意为: 分步总数量为 1,当前为第 1 步。如下图所示:

、 🚺 诚创立 <sup>®</sup>	总数: 🚦	良品:	0	不良品:	۵
测试任务 测试内	容 线材学习	导通电阻	高压	元器件	系统
测试方式: <u>一般</u> ;	则试	0S测试:	开启		OS测试
0S短路电阻: 5K	$\Omega \rightarrow$	导通测试:	开启		导通测试
单边灵敏度: 20 导通阻抗: 0.150	Ω	DC绝缘测试:	开启		DC测试
0S瞬短测试时间:	0.5005	AC耐压测试:	开启		AC测试
手动测试适应时间:	0.2005	元件测试:	开启		元件测试
元亚洲低切换方式: 定时模式间隔时间:	▲目初识别 】 1.000S	摇摆测试:	开启		拉油道学
00 08 2370 35% 档	案:12	测试步	聚: 1/ 1	治具耐磨	告 法 则 LL

2.添加步骤方法:保持按住【转换】键的同时,按方向键【↑】为添加步骤;
保持按住【转换】键的同时,按方向键【↑】为添加步骤,
保持按住【转换】键的同时,按方向键【↓】为删除当前步骤,
保持按住【转换】键的同时,按方向键【左右】为切换步骤,查看各个步骤在当前界面中的 设置参数。(此功能只在各个设置界面生效,系统界面和主界面,无效)
3.按住【转换】键,按方向键【↑】一次,添加一个步骤,如下图:

	<b>ல</b> ர	如	Z				<u>11</u>
Ĺ	🚺 诚创立	·® 总数	k: 0	良品:	0	不良品:	0
	测试任务	测试内容	线材学习	导通电阻	高压	元器件	系统
	测试方式:	(一般测试		0S测试:	开启		0S测试
	OS断路电阻 OS短路电阻	: < 5KΩ : < 5KΩ		导通测试:	开启		导通测试
	单辺灵敏度: 导通阻抗:	20 0.150Ω		DC绝缘测试:	开启		DC测试
	OS瞬短测试 OS瞬断测试	时间: ( 时间: (	0.500S	AC耐压测试:	开启		AC测试
	手动测试适加	应时间: 换方式:	0.200S ] 动识别 )	元件测试:	开启		元件测试
	定时模式间	隔时间:	1.000S	摇摆测试:	开启		摇摆测试
	<b>3785 25:5</b>	<b>15% 档案:1</b>	2	测试步	骤: 2/2	2 治具耐風	簪:无限制

当前 {测试步骤} 为 2/2,示意为:当前界面为第 2 步,分步总数为 2.

技巧:在【模式】【查点】【元件】【导通】【高压】【读点】6个界面中,都可以用【转换】 键+方向键(左右)自由切换查看当前步骤的设置参数。

如【查点】界面,以下两个图片所示

第一步界面:

$\overline{U}$	<b>V</b> 1	或创立	<u>,</u> ®	息数: 	{	) 良品:	0	不良品:	0
Ĺ	测试	任务	测试内容	容 线	材学习	导通电阻	高压	元器件	系统
测试方式:一般测试 断路			各电阻: 5H	(Ω 短距	格电阻:5KΩ	灵敏度:20	0 <u>4</u> 16点		
	序号	组别	名称		迫	E接点位		测量条件	
	1	1	7P	AC	3-A4-B5	-B16-B17-B2	28	<5KΩ	分组万式
				-B29 A7-B23 A9-B22				工程内示	
	2	1	2P.				<5KΩ	<b>开始归令</b>	
	3	1	2P				<5KΩ		
	4	1	5P	ł	12-B8-	B13-B20-B25	5	<5KΩ	起始归令
l									参数设置
	18:31	<b>28</b> °C	<b>15% 档</b> 算	₹:12		测试力	<b>5骤:</b> 1/	2 治具耐	磨:无限制

第二步界面:

7	<b>V</b> 1	成创立	-® #	总数:	0	良品:	0	不良品:	٥
	测试	任务	测试内容	容 线权	学习	导通电阻	高压	元器件	系统
1	测试方	式:一角	受测试 断距	烙电阻:5K	2 短路	各电阻:5KΩ 5	見敏度:20	<b>4</b> 16点	
	序号	组别	名称		连	接点位		测量条件	
	1	1	7P	A3-	A4-B5-	-B16-B17-B2	8	<5KΩ	分组万式
					-	-B29			工改旧委
	2	1	2P		A .	7-B10		<5KΩ	71 - 四
	3	1	2P		AS	9-B11		<5KΩ	病效归季
	4	1	5P	A1	2-B8-B	B13-B20-B25		<5KΩ	た町空令
								رل	参数设置
	12:31	28 0	19% 档3	E-12		测试光	·骤·2/	2 治且耐	摩· 无限制

(注意:此时可发现,两个步骤中 TYPE-C 因插入的面不一样,导致点位排列也会不一样。 此功能可用于,在分步时自行检查两个步骤的相关设置并修改。)

4.完成添加分步后,能直接复制到第二步的参数,不需再进行设置。(如:【高压】【模式】) 5.将 TYPE-C 产品反一面插入治具中,按【读点】读取该面的点位。(注意:当前步骤应为 2/2,不要把第一步的数据覆盖了)

6.按【元件】进入{元器件}设置界面中,将之前找出来的该面脚位,按上述添加电阻的方法,进行添加。(相关步骤省略,请参照电阻添加方法。)

7.按【导通】进入 {导通阻抗} 设置界面中,编辑 VBUS, GND, D+,D-的导通电阻标准值 方法同上,省略

8.检查并确认相关设置,确认无误后按【保存】键保存到当前档案。

### 步骤 7.【系统】设置

 1.按【系统】,进行系统设置界面,按方向键(左右)切换菜单 将菜单页面切换至【其它 2]
 2.按方向键(上下)移动光标至对应项,

<b>W</b> i成 创	<b>İ</b> Ž <sup>®</sup>				<u>13</u>
₩N 诚创立 <sup>®</sup>	总数:	0 良品:	0	不良品:	0
测试任务 测试内	內容 线材学	习 导通电阻	高压	元器件	系统
背光/声音 密码设置	通信设置 DC校	准 AC校准 系统归	零其他	其他2	
17.自动保存档案:	< 是 →	25.RCD影响所有	步骤: 🗍		
18.ARC抓取模式:	∢ 普通 ▶	26.屏蔽线点位:		无	
19.摇摆提示音:	▲ 开启 ▶	27.分步测试模式			
20. 拥科测试致重:		28.分 <b>步</b> 惧式有效	(		
21. 两低报告借式。 22. 报告自动保存:		29.KOFT高压。 30 启动测试回路	数·>		
23. Cond量程切换:	(美闭)	31.线材拔出判定	(一边技		
24.VCC网络断路范	围: 0.000	32. 无限摇摆外剖	3触发:	0	
# XEI 370E 05 EI	当案:12	测试步	骤: 2/ 2	2 治具耐磨	王 无限制
设置 {27.分步测试模式}	按【确认】更改	为 {智能匹配}			

设置 {28.分步模式有效步数} 按数字键盘输入 1, 按【确认】键确认 设置 {30.启动测试回路数}按数字键盘输入 1, 按【确认】键确认 其它非常规的选项,请参照实际需求,由客户自定.不一一叙述

9.检查设置参数,按【保存】键,将所有设置参数存入当前档案中。 10.完成设置,按【测试】键启动测试

W	诚创立	<mark>了<sup>®</sup>    总数:</mark>	0	良品:	[] 不良品:	0
测	试任务	测试内容	线材学习	导通电阻	高压 元器件	- 系统
					试耗时:2.347S	错误解锁
	1.09306	* 竡彬致中阳			(01/00)	结果显示
Y	1.03%% 序号 1	<u>送</u> 法接对 A3-A4	- 5KΩ 导通阻抗 0.354Ω	绝缘阻抗 >1000MΩ		测试选项
	2 3 4	A4-B5 B5-B16 B16-B17	0.482Ω 0.478Ω 0.3770	>1000MΩ >1000MΩ >1000MΩ	0.053mA 0.053mA 0.053mA	统计信息
	5 6 7	B17-B28 B28-B29 A7-B10	0.528Ω 1.175Ω 0.582Ω	>1000MΩ >1000MΩ >1000MΩ	0.053mA 0.053mA 0.026mA	开路归零
L	Ś	A9-B11	0.661Ω	>1000M Ω	0.027mA	短路归零
8	<b>J9 30</b> °C	3% 档案:12		测试步	骤: 1/ 2   治具耐	磨:无限制

调机步骤